Session IX, Thursday, June 22



Examples of Application of Phase Analysis in Forensic Practice - 3 PŘÍKLADY APLIKACE FÁZOVÉ ANALÝZY VE FORENZNÍ PRAXI – 3 M. Kotrlý

Kriminalistický ústav Praha, PČR, Bartolomějská 12, Praha 1

At world market can be currently encountered a wide range of objects that are incorrectly declared, treated, or it concerns completely different materials that try to copy commodities more or less successfully. Materials in question are made using the latest technologies, however, only simple equipment is not sufficient to identify the true state of objects.

Úvod

Na světovém trhu se lze aktuálně setkat s velmi širokým spektrem objektů, které jsou chybně deklarované, upravované (treatment), nebo jde o zcela jiné materiály, které originální komodity s větším či menším úspěchem napodobují. Často jde o materiály vyrobené pomocí nejmodernějších technologií, kde ke zjištění pravého stavu věcí nepostačuje jen jednoduché vybavení.

Metodika

Základními technikami analýzy jsou optická polarizační mikroskopie, SEM/EDS/WDS, XRD, Ramanova spektroskopie a další metody. Pomocí optických metod lze identifikovat řadu syntetických materiálů, které jsou deklarovány jako přírodní, pomocí studia minerálních a technologických inkluzí, plynokapalných uzavřenin a vnitřních struktur. Technika je také ve většině případů dostačující pro prokázání pravosti vltavínů, které jsou v broušených kamenech často nahrazovány sklem. U některých materiálů chemická analýza selhává, protože syntetiky mají složení identické s přírodní fází. Přírodní vltavíny obsahují lechatelieritové inkluze, které se v náhradách nevyskytují a které lze relativně dobře prokázat optickým mikroskopem.

Pro některé materiály je výhodné využití mikrospektrofotometrie, která může napomoci k odlišení fází, které mají přesně definovanou barvu. Jedná se např.o tzv. české granáty (Český granát a Český granátový šperk jsou celosvětově velmi známé a jsou chráněny Úřadem průmyslového vlastnictví pod čísly 80 - "Český granáť" a 81 -"Český granátový šperk"). Mineralogicky se jedná o granáty s výraznou převahou pyropové složky, stabilním obsahem chrómu a hořčíku, pocházející z teritoriálně velmi omezeného území, které jsou charakteristické svou temně červenou barvou (označovanou někdy jako tzv. "barva holubí krve"). Pro prvotní rychlou orientaci v analyzovaných materiálech se v praxi velmi dobře osvědčilo kvantitativní měření barevnosti. Protože reprodukovatelné měření broušených kamenů zasazených ve špercích není zcela triviální, bylo testováno několik mikrospektrofotometrických systémů - s použitím optických mikroskopů, přímé makroskopické měření se vstupní pupilou

světlovodu přiblíženou k měřenému objektu, i měření s použitím integrační koule "Labshere". Významné je fokusované osvětlení jen části kamene, pro minimalizaci reflexí. Byla testována řada spektrometrů – např. fy Avantes – AvaSpec 2048, a další, Stellarnet – Black Comet CXR, Carl Zeiss MCS UV/NIR USB, etc. Výsledky ukazují, že citlivost spektrometrů se v jednotlivých částech spektra vzájemně liší a pro praxi je možné komparovat vždy jen měření provedená na identickém zařízení.

Pro studium chemického složení jsou nejčastěji využívány systémy SEM/EDS/WDS a XRF/mikroXRF. Při analýzách facetovaných kamenů zasazených ve špercích na systémech SEM může být v některých případech kritická jednak homogenita signálu v ploše při nestandardních pracovních vzdálenostech, tak i pozice analyzované plochy vůči detektoru SEM a ohledem na aplikaci ZAF korekcí. Provedené experimenty ukázaly, že rozdíly ve výsledcích kvantitativní analýzy homogenního materiálu, prováděné z plošek, které mají různé geometrické pozice vůči detektoru mohou činit až desítky procent. Všechny tyto faktory lze samozřejmě korigovat, ale obsluha systému nesmí k analýze přistupovat postupem "jeden stisk tlačítka vede ke kompletnímu výsledku".

Pro kalibrace kvantitativní analýzy jsou nezbytné standardy. Při jejich testování se bohužel trvale ukazuje, že některé nemusí být příliš kvalitní a to i od renomovaných dodavatelů. Byly zjištěny např. zbytky leštících prášků zasekané do povrchu měkkých materiálů, které mohou velmi zkreslit následné použití standardu, nehomogenita, apod.

Poměrně časté jsou úpravy gemologických objektů spočívající ve výplni mikroprasklin sklem s vysokým indexem lomu. Jedná se o úpravy, které nejsou zakázány, ale musí být u kamene deklarovány, což se bohužel velmi často neděje. Tyto zásahy lze velmi dobře dokumentovat pomocí plošného mappingu pomocí SEM/EDS, popř. mikroXRF.

Pro pomoc při, v některých případech problematické klasifikace perel (zejména rozlišení tzv. přírodní versus cultivated pearls, které se velmi výrazně liší cenou, ale mohou mít stejné složení povrchu i mikroskopické povrchové charakteristiky) byly testovány možnosti rentgenového průsvitu. Byla vyvinuta metoda rentgenového průsvitu, který je možné realizovat i na stolních XRF zařízeních s transmisním detektorem.

Závěr

Provedené experimenty prokázaly, že pro odlišení moderních sofistikovaných imitací gemologických objektů nepostačuje jen prostá lupa, což si někteří gemologové stále plně nepřipouštějí. Kromě výše uvedených technik jsou využívány i další postupy – FTIR, XRD, mikroXRD, atd.

Podvody se záměnou přírodních kamenů za jejich imitace jsou bohužel velmi časté. Při jedné kontrolní akci České obchodní inspekce provedené ve 3 městech České

L27

republiky byly, při následných expertízách šperků odebraných při kontrolních nákupech, zjištěny ve 100% případů kameny, které byly chybně deklarovány. Buď se jednalo o jiné drahé kameny, či syntetické imitace, které byly vydávány za přírodní materiály.

POLYMER-FULLERENE PHASE SEPARATION BY LABORATORY IN-SITU GISAXS AND GIWAXS

M. Jergel¹, K. Vegso², P. Šiffalovič¹, P. Nádaždy¹, V. Nádaždy¹, E. Majková¹

¹Institute of Physics SAS, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, Slovakia
²Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 1-1-1 Kouto, 679-5198 Hyogo, Japan matej.jergel@savba.sk

Keywords: polymer:fullerene blend, organic solar cell, solvent annealing, GISAXS, GIWAXS

Abstract

Active layer in organic solar cells is bulk heterojunction consisting of a fullerene (acceptor) and a polymer (donor). As the diffusion length of the photon-generated exciton is very short, the size of polymer and fullerene domains has to be minimized by processing the polymer:fullerene blend in solvent vapours (solvent annealing). This is an unavoidable preparation step of the solar cell. Here, we present an in-situ real-time tracking of the phase separation between P3HT polymer and PCBM fullerene during solvent annealing by simultaneous GISAXS and GIWAXS measurements using the latest generation table-top high-brilliance X-ray source. We identify fullerene agglomeration and polymer crystallization to be the driving forces of the process. Being performed in laboratory instead at a synchrotron beamline, we demonstrate by this study also the potential of this approach to provide a handy feedback for technology development.

Introduction

Organic photovoltaics is attractive because of low cost of input materials and possibility to apply the roll-to-roll fabrication technology on flexible substrates. The active layer is a bi-continuous network of fullerene (acceptor) and polymer (donor) that is called bulk heterojunction (BHJ). As photon-generated electron-hole pair (exciton) diffusion path is very short (10 nm), the exciton must reach the polymer/fullerene interface fast to be dissociated into free hole and free electron before recombination occurs. Therefore, the size of polymer and fullerene domains in BHJ has to be very small. Refinement of BHJ morphology is achieved by processing the polymer:fullerene blend in solvent vapours (solvent annealing). To optimize this preparation step of solar cell, the underlying mechanism has to be studied in detail. In this contribution, we present an in-situ real-time tracking of the phase separation between polymer and fullerene during solvent annealing by simultaneous measurements of the grazing-incidence small-angle- and grazing-incidence wide-angle X-ray scattering (GISAXS, GIWAXS). A blend of poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) (P3HT) and [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM) dissolved in dichlorobenzene was used.

Experimental details

The GISAXS and GIWAXS measurements were done simultaneously on a custom-designed Nanostar device (Bruker) equipped with a table-top Ga liquid metal-jet X-ray source Excillum at 0.134 nm wavelength (Fig. 1). The collimated X-ray beam of 0.5 mrad divergence exiting Montel optics (Incoatec) was shaped by a pinhole collimator to a diameter of 550 m, the output photon flux being 3 10^8 photons/s. The incident angle of X-ray beam on the sample was set to 0.2°. The GIWAXS was measured by a one-dimensional (1D) X-ray detector Mythen (Dectris) oriented perpendicular to the sample surface with the exposure time of every pattern set to 2.5 s. The GISAXS was measured by a two-dimensional (2D) X-ray detector Pilatus 300K (Dectris) with the exposure time of every pattern set to 10 s. The GISAXS flight tube was fully



Figure 1. Nanostar device equipped with a table-top Ga liquid metal-jet X-ray source Excillum.



Figure 2. Temporal evolution of the PCBM cluster growth and its JMA fit. The upper horizontal axis refers to the increasing concentration of solid content in the blend due to the solvent evaporation during solvent annealing.

evacuated. The sample was prepared from a mixture of P3HT and PCBM in 1.5:1 wt/wt ratio dissolved in dichlorobenzene at a concentration of 2 wt%. 50 L of the blend was spin-coated onto a pre-cleaned silicon substrate at a rate of 15 rps for a time duration of 15 s. The sample was subsequently mounted on a pre-aligned hexapod with six degrees of freedom. The solvent annealing was realized by covering the sample by a Petri dish equipped with two X-ray transparent windows. The X-ray detectors were manually triggered at the start of solvent annealing. Repeated collection of the GISAXS and GIWAXS patterns during solvent evaporation provided a "movie" of the phase separation in reciprocal space.

GISAXS and GIWAXS analyses

Temporal evolution of the radius of gyration R_g during solvent annealing derived from GISAXS Guinier plots shows an initial abrupt increase followed by approaching to saturation (Fig. 2) that is attributed to growth of PCBM clusters. In a particular case of spherical PCBM clusters, the cluster radius $R = \sqrt{5/3R_g}$. The clusters are detectable above 7 wt% of solid content and their growth starts to saturate above 10 wt% (Fig. 2). If we assume a constant num(2017)

ber of the growing PCBM clusters after they emerge in GISAXS pattern, a fit of the temporal evolution of the radius of gyration based on Johnson-Mehl-Avrami (JMA) equation (Fig. 2) provides PCBM solubility limit 7.1 \pm 0.1 wt% and the rate constant of PCBM cluster growth (33 \pm 2) 10^{-4} s⁻¹.

The final GIWAXS pattern of the dried P3HT:PCBM blend on solvent annealing confirms presence of the crystalline P3HT lamellar phase with the edge-on lamellae orientation in P3HT domains (Fig. 3a). Temporal evolution of the area under P3HT 100 diffraction peak along q_z axis during solvent annealing, that is proportional to the growing volume of P3HT crystalline phase, was analyzed within JMA formalism, revealing two rate constants. The first stage of P3HT crystal growth is completed by solvent evaporation, the rate constant being (10 ± 2) 10^{-3} s⁻¹. The Avrami exponent close to 2 indicates heterogeneous nucleation with 2D crystallite growth [1]. The second stage is characterized by a much smaller rate constant (20 ± 7) 10^{-4} s⁻¹, being dominated by a gradual slow release of residual solvent molecules. Both stages are manifested also in d_{100} lattice spacing evolution (Fig. 3b). GIWAXS cannot provide any information on PCBM as its diffraction ring is overlaid by a strong diffraction of the solvent.

A concept of Porod invariant [2, 3] was applied to evaluate intermediate stage of phase separation between the initial PCBM agglomeration and final P3HT crystallization. In particular, the temporal evolution of a quantity

$$(t) \quad \frac{q^2 I(q) dq}{q^2 I(q) dq} \qquad (1)$$

$$\frac{q^2 I(q) dq}{q^2}$$

was evaluated from the in-situ measured GISAXS patterns. Here, I(q) is a lateral cut of GISAXS pattern at the critical angle that exhibits an interference peak from 900 s of solvent annealing, $q^2I(q)$ is Kratky plot and the integration in numerator and denominator of eq. (1) runs over a selected Q1 range around the expected or already present interference peak and over the total Q2 recorded range, respectively. Therefore, (*t*) provides information on a fraction of the sample volume coherently scattering into the se-



Figure 3. (a) GIWAXS pattern of P3HT:PCBM blend taken ex-situ on solvent annealing and (b) temporal evolution of the position of 100 diffraction peak of P3HT along q_z axis and the corresponding interplanar spacing derived from the in-situ measured GIWAXS patterns during solvent annealing.

Krystalografická společnost



Figure 4. Scenario of solvent annealing based on GISAXS and GIWAXS results.

lected Q1 range of reciprocal space at a given moment t of solvent annealing, being independent of a continuously changing electron density in the irradiated volume due to solvent evaporation. It is a true fingerprint of the phase separation between P3HT and PCBM that controls the final BHJ morphology.

Discussion and conclusions

Putting together GISAXS and GIWAXS results, scenario of solvent annealing can be divided into 5 principal stages (Fig. 4). At stage I, P3HT and PCBM molecules are randomly distributed in the solution and no phase separation proceeds, (t) being constant. The phase separation driven by agglomeration of PCBM molecules into fast-growing clusters, as evidenced by increasing radius of gyration R_g , is observed at stage II when (t) steadily increases. At stage III, the cluster growth is slowed-down but the increase of (t) ratio continues without a visible slope change. Presumably, P3HT molecular chains are stretching and ordering during solvent evaporation. This facilitates release of PCBM molecules from P3HT-rich domains and prepares P3HT crystallization that is observed from stage IV. Being longer than two previous ones, stage III is the most important for formation of a fine and thermodynamically stable BHJ morphology. Stage IV is dominated by an abrupt decrease of d_{100} spacing as a marker of P3HT crystallization that is well correlated with a steep increase of (*t*). Hence, P3HT crystallization is the driving force of phase separation at stage IV. Stage V is characterized by a slow saturation of (*t*) ratio suggesting the end of phase separation that is controlled by a slow release of residual solvent molecules.

Summarizing, we presented an in-situ comprehensive study comprising all relevant stages of phase separation during solvent annealing of a prototypical P3HT:PCBM blend that is used as active layer in organic solar cells. The solvent annealing was done in the same way as that used for standard preparation of organic solar cells. The latest generation table-top high-brilliance X-ray source allowed simultaneous

GISAXS and GIWAXS measurements of the process in real time. Hence, our work demonstrates a general possibility of such in-situ GISAXS and GIWAXS laboratory studies of organic and hybrid solar cells as viable pre-screening techniques for everyday use before more sophisticated X-ray scattering experiments at synchrotron beamlines are undertaken.

- E. Verploegen, R. Mondal, C. J. Bettinger, S. Sok, M. F. Toney, Z. Bao, *Adv. Funct. Mater.*, **20**, (2010), 3519.
- 2. O. Glatter, O. Kratky, *Small Angle X-ray Scattering*. London: Academic Press. 1982.
- R. J. Roe, Methods of X-ray and Neutron Scattering in Polymer Science. New York: Oxford University Press. 2000.

The work was done during implementation of the project Research and Development Centre for Advanced X-ray Technologies, ITMS code 26220220170, supported by the Research and Development Operational Programme funded by the ERDF.